

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт
метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)**

Адрес: 11936, г. Москва, ул. Озерная, 46

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ МИВ-01-2015.203.1/10-2015
об аттестации методики измерений
№ МИВ-01-2015**

Методика выполнения измерений перепадов высот в нанометровом диапазоне с применением сканирующего зондового микроскопа СмартСПМ-1000, разработанная ФГАОУ ВПО «НИУ «МИЭТ», регламентирована в документе «Методика измерений перепадов высот в нанометровом диапазоне методами сканирующей зондовой микроскопии» и аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009, 8 стр., 2015 г.

Аттестация осуществлена по результатам экспериментально-расчетного оценивания пределов допускаемой погрешности.

В результате аттестации установлено, что методика выполнения измерений перепадов высот в нанометровом диапазоне с применением сканирующего зондового микроскопа СмартСПМ-1000 соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает метрологическими характеристиками:

- диапазон измерений: от 1 нм до 12 мкм;
- пределы допускаемой относительной погрешности: не более $\pm 2\%$ (при доверительной вероятности 95%).

Зам. директора

В.Н.Яншин

« 19 » 10 2015 г.

